# XRR 解析レポート

### プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

#### 解析条件

波長(nm): 0.15403 点数: 1451

2θ(°):開始 = 0.200,終了 = 6.000 残差タイプ: |Δ(LogI)| ステップ = 0.004

オフセット=0.000e+000

フィッティング手法: Nelder-Mead データ間隔:1点ごとにフィッティング

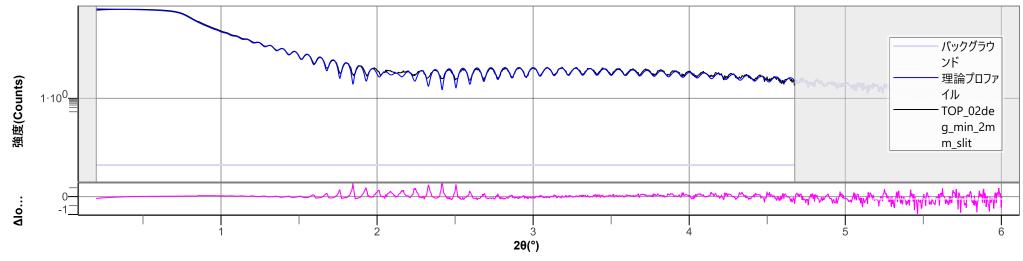
最大反復数: 500

許容誤差: 1.00e-015

装置関数: 擬Voigt関数 ローレンツ関数の比率: 0.00 ローレンツ幅: 1.00e-002 ガウス幅: 1.00e-002

## 結果

## プロファイルプロット



	使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)		────密度(g/cm³) <d></d>		粗さ(nm) <rgh></rgh>	
	$\checkmark$	L4	Fe2O3	1.376	Const	2.47500	Const	1.348	Con
	<b>✓</b>	L3	Fe2O3	2.195	Const	4.95000	Const	0.100	Con
		LS	. * . 10203	±0.007	精密化	4.55000	COLISC	0.100	C011
	<b>✓</b>			93.261	Const	7.86952	Const	0.457	Con
				±0.019	→最大 精密化				
	$\checkmark$	L1	Fe Fe	1.131	Const	3.93700	Const	0.397	Con
	$\checkmark$	基板	<b>⊡</b> Si	00		2.32924	Const	0.500	Con